

矽弼半导体探针台

产品名称	矽弼半导体探针台
公司名称	深圳市泰斯特尔系统科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道下李朗南路东久创新科技园3栋5楼
联系电话	0755-23303946

产品详情

PXB-S系列探针台

PXB系列探针台主要特点

- 可选直筒显微镜和体式显微镜
- 载物台可Z轴升降
- 载物台Theta可粗调360°，微调 $\pm 7^\circ$
- 载物台XY移动分辨率为1um。
- 可选配高压高流测试环境
- 快速装片并可任意位置锁定功能
- 显微镜支架万向杆

PXB系列探针台应用领域

- Wafer level reliability 晶元可靠性认证
- Device characterization 元器件特性量测
- Process modeling 塑性过程测试(材料特性分析)
- IC Process monitoring 制成监控
- Package part probing IC封装阶段打线品质测试
- ESD&TDR testing ESD和TDR测试
- Microwave probing 微波量测(高频测试)
- Solar太阳能领域检测分析
- LED、OLED、LCD领域检测分析

PCB领域检测分析

VESEL DFB,COC,硅光等光电器件测试

PXB-M系列探针台

PXB-M系列探针台主要特点

可选直筒显微镜，体式显微镜或金相显微镜

载物台可Z轴升降

载物台Theta可粗调360°，微调 $\pm 7^\circ$

载物台XY移动分辨率为1um

可选配高压高流测试环境

快速装片并可任意位置锁定功能

稳定型显微镜桥架，移动分辨率为2um，显微镜气动升降

PXB-M系列探针台应用领域

Failure analysis 集成电路失效分析

Wafer level reliability 晶圆可靠性认证

Device characterization 元器件特性量测

Process modeling 塑性过程测试(材料特性分析)

IC Process monitoring 制成监控

Package part probing IC封装阶段打线品质测试

ESD&TDR testing ESD和TDR测试

Microwave probing 微波量测(高频测试)

Solar太阳能领域检测分析

LED、OLED、LCD领域检测分析

PCB领域检测分析

VESEL DFB,COC,硅光等光电器件测试

PXB-E系列探针台

PXB-E系列探针台主要特点

可选配高温测试环境

可选直筒显微镜，体式显微镜或金相显微镜

载物台气浮快速移动

可选配高压高流测试环境

快速装片并可任意位置锁定功能

稳定型显微镜桥架，移动分辨率为2um，显微镜气动升降

Platen 三阶抬杆，微调移动行程为40mm，抬杆重复性精度为2um

PXB-E系列探针台应用领域

Failure analysis 集成电路失效分析

Wafer level reliability 晶圆可靠性认证

Device characterization 元器件特性量测

Process modeling 塑性过程测试(材料特性分析)

IC Process monitoring 制成监控

Package part probing IC封装阶段打线品质测试

ESD&TDR testing ESD和TDR测试

Microwave probing 微波量测(高频测试)

Solar太阳能领域检测分析

LED、OLED、LCD领域检测分析

PCB领域检测分析

VESEL DFB,COC,硅光等光电器件测试

PXB-BE系列探针台

PXB-BE系列探针台主要特点

可选配高温测试环境

可选直筒显微镜，体式显微镜或金相显微镜

载物台气浮快速移动，三档控制，X轴独立控制，Y轴独立控制，XY同步控制，XY同步控制

可选配高压高流测试环境

快速装片并可任意位置锁定功能

稳定型显微镜桥架，移动分辨率为2um，显微镜气动升降

Platen 二阶抬杆，微调移动行程为60mm，

抬杆重复性精度为1um

配置独立控制压力阀

PXB-BE系列探针台应用领域

Failure analysis 集成电路失效分析
Wafer level reliability 晶圆可靠性认证
Device characterization 元器件特性量测
Process modeling 塑性过程测试(材料特性分析)
IC Process monitoring 制成监控
Package part probing IC封装阶段打线品质测试
ESD&TDR testing ESD和TDR测试
Microwave probing 微波量测(高频测试)
Solar太阳能领域检测分析
LED、OLED、LCD领域检测分析
PCB领域检测分析
VESEL DFB,COC,硅光等光电器件测试

PXB-BET系列探针台

PXB-BET系列高低温探针台主要特点

搭配高低温系统，zui大范围-65 到300
可选直筒显微镜，体式显微镜或金相显微镜
载物台气浮快速移动，三档控制，X轴独立控制，Y轴独立控制，XY同步控制，XY同步控制
可选配高压高流测试环境
装片拉出装置，定位锁住
稳定型显微镜桥架，移动分辨率为2um，显微镜气动升降
Platen 二阶抬杆，一次性行程为6mm，抬杆重复性精度为1um，四点同步
配置独立控制气流阀

PXB-BET系列高低温探针台应用领域

Failure analysis 集成电路失效分析
Wafer level reliability 晶圆可靠性认证
Device characterization 元器件特性量测
Process modeling 塑性过程测试(材料特性分析)
IC Process monitoring 制成监控
Package part probing IC封装阶段打线品质测试

ESD&TDR testing ESD和TDR测试
Microwave probing 微波量测(高频测试)
Solar太阳能领域检测分析
LED、OLED、LCD领域检测分析
PCB领域检测分析
VESEL DFB,COC,硅光等光电器件测试

PXB-D系列探针台

PXB-D系列探针台主要特点

可选配高温测试环境
可选直筒显微镜，体式显微镜
载物台气浮快速移动
可选配高压高流测试环境
platen上下结构，可正反面同时扎针
载物台双面镂空，可替换，一个镂空夹具，一个载物台（两个吸附孔）
背置式直筒显微镜，zoom为0.58-7.5x
Platen 微调行程为40mm，移动分辨率为1um，四点同步

PXB-D系列探针台应用领域

Failure analysis 集成电路失效分析
Wafer level reliability 晶圆可靠性认证
Device characterization 元器件特性量测
Process modeling 塑性过程测试(材料特性分析)
IC Process monitoring 制成监控
Package part probing IC封装阶段打线品质测试
ESD&TDR testing ESD和TDR测试
Microwave probing 微波量测(高频测试)
PCB领域检测分析

PXB-W系列探针台

PXB-W系列探针台主要特点

可选配110Ghz，220Ghz等测试环境
搭配高低温系统，zui大范围-65 到300
可选直筒显微镜，体式显微镜或金相显微镜
载物台气浮快速移动，三档控制，X轴独立控制，Y轴独立控制，XY同步控制，XY同步控制
装片拉出装置，定位锁住
稳定型显微镜桥架，移动分辨率为2um，显微镜 气动升降
Platen 二阶抬杆，一次性行程为6mm，抬杆重复 性精度为1um，四点同步

配置独立控制气流阀

PXB-W系列探针台应用领域

Microwave probing 微波量测(高频测试)

PXB-PL系列探针台

PXB-PL系列探针台(定制型)

针对PCB&LCD&OLED&MINI-LED研发的测试探针台

主要客户：英业达，沪利，深南电路，美维，奥克斯，大金，龙腾光电，群策等

PXB-VL系列探针台

PXB-VL系列探针台产品简介

PXB-VL高低温真空探针台是我司自主研发的一款在极端环境下给样品加载电学信号的设备。可以实现器件及材料表征的IV/CV特性测试，射频测试，光电测试等。通过液氮或者压缩机制冷，可以在防辐射屏内营造一个稳定的测试环境。在特殊材料，半导体器件等研究方向具有广泛运用。一般用于相关单位实验室。

PXB-SA系列探针台

PXB-SA系列探针台产品简介

PXB-SA系列探针台是一款在非真空条件下实现高低温环境的测试探针台。

该产品采用气冷制冷，自动控温，设备配置非常丰富。自带屏蔽暗室，一方面可以屏蔽无线电磁干扰，另外一方面也可以保持氮气正压环境下样品在低温时无结霜。该产品多数用于相关单位实验室。

PXB-SA系列探针台产品优势

可搭配高低温温控系统,温度范围为-60-300

可实现半自动测试

微腔屏蔽